ЯМР ядер ⁵³Cr в ферромагнитном CuCr₂S₄: Sb

© В.Н. Бержанский, А.И. Горбованов, С.Н. Полулях

Таврический национальный университет, 95007 Симферополь, Украина E-mail: roton@crimea.edu

(Поступила в Редакцию 27 мая 2004 г.)

Рассматривается влияние эффектов переменной валентности на спектры ЯМР ядер ⁵³Сг в ферромагнитном $CuCr_{2-x}Sb_xS_4$ (x = 0, 0.02, 0.07) при T = 77 К. Для квадрупольных ядер в локально анизотропных позициях эффекты переменной валентности приводят к усреднению не только резонансной частоты, но и квадрупольной и магнитной анизотропных постоянных. Существенное отличие экспериментальных значений этих констант от расчетных свидетельствует о значительной роли собственного электронного вклада в анизотропию сверхтонких полей соединений, содержащих ионы Cr^{4+} . Обнаружены дополнительные линии в спектрах легированных и нелегированных соединений, которые обусловлены естественной и наведенной дефектностью структуры.

1. Введение

Фееромагнетики на основе халькогенидных шпинелей хрома ACr_2X_4 (где A = Cd, Hg, Cu и т.д. X = S, Se, Te) — важный класс магнитоупорядоченных материалов. По своим электрическим свойствам в большинстве случаев это полупроводники. Особое место в ряду таких соединений занимают медные шпинели CuCr₂X₄, обнаруживающие металлический тип проводимости и высокие температуры магнитного упорядочения [1]. При анализе физических свойств этих соединений существенным является вопрос о валентном состоянии катионов. Один из путей решения этого вопроса состоит в применении метода ЯМР.

В магнитоупорядоченных материалах частота ЯМР определяется локальными сверхтонкими полями на ядрах [2]. Поле на ядре прямо пропорционально величине магнитного момента иона. Изменение валентного состояния приводит к изменениию величины магнитного момента, так что величина сверхтонкого поля в первом приближении прямо пропорциональна числу неспаренных электронов.

Эффекты переменной валентности состоят в том, что валентность иона флуктуирует во времени, принимая одно из двух возможных значений. Для парамагнитной ядерной спиновой системы такие флуктуации приводят к хорошо известной в теории ЭПР ситуации обмена между двумя частотами [3,4]. Если частота флуктуаций меньше, чем разность резонансных частот в каждом из состояний (медленный обмен), спектр магнитного резонанса представлен суперпозицией спектральных линий. В случае быстрого обмена наблюдается одиночная линия на усредненной частоте.

Влияние эффектов переменной валентности на спектры ЯМР ядер 53 Сг в ферромагнитном CuCr₂S₄ наблюдалось экспериментально в работах [5,6]. На основе анализа частотного положения спектральных линий было показано, что при низких температурах сосуществуют как трех-, так и четырехвалентные ионы хрома. С повышением температуры появляется дополнительная линия, частотное положение которой соответствует состоянию с дробной валентностью $Cr^{3.5+}$. Дальнейший рост температуры приводит к увеличению интенсивности этой линии, при T = 77 K основным наблюдаемым состоянием является состояние $Cr^{3.5+}$.

В структуре шпинели ионы хрома занимают октаэдрические позиции с локальной симметрией 3*m*. В этом случае существенное влияние на форму спектральной линии оказывает анизотропия локального магнитного поля и электрические квадрупольные взаимодействия. Однако форма спектральной линии в работах [5,6] не обсуждалась. В то же время анализ формы линии ЯМР позволяет получить информацию о вкладе вакансий и иновалентных примесей в формирование физических свойств этих соединений. Как правило, реальные образцы нестехиометричны и содержат анионные вакансии. В отличие от случая кислородных шпинелей анионные вакансии в халькогенидных шпинелях не приводят к существенному изменению межатомных расстояний. Так, например, структура CuCr₂S_{4-v} остается гомогенной при $0 \le y \le 0.17$ [1].

При исследовании ЯМР ядер меди в CuCr₂S₄ в работе [7] по наличию многоквантовых сигналов спинового эха установлено существование квадрупольного уширения спектральных линий, несмотря на то что ионы меди занимают тетраэдрические позиции, для которых градиент электрического поля должен отсутствовать. Это свидетельствует о наличии локальных искажений тетраэдрических позиций.

Наряду с анионными вакансиями существенное влияние на физические свойства халькогенидных шпинелей оказывают примесные ионы. Так, при исследовании магнитных свойств $CuCr_{2-x}Sb_xS_4$ при больших концентрациях легирующей примеси был обнаружен переход в спин-стекольную фазу [8], что свидетельствует о сильном влиянии этих примесей на обменные взаимодействия.

Целью настоящей работы является исследование влияния эффектов переменной валентности, анионных вакансий и легирования сурьмой на форму спектральной линии ЯМР ядер ⁵³Cr в сульфохромите меди. Для исследования сигналов ЯМР использовался импульсный некогерентный спектрометр ЯМР. Регистрация спектров магнитного резонанса осуществлялась по зависимости амплитуды V сигнала двухимпульсного эха от частоты колебаний переменного магнитного поля в возбуждающих импульсах. Были исследованы поликристаллические образцы CuCr_{2-x}Sb_xS₄ с разной степенью замещения Sb (x = 0, 0.02, 0.07) при температуре T = 77 К. Спектры ядер ⁵³Cr этих образцов представлены на рис. 1 сплошными линиями.

Экспериментально обнаружено, что спектр ЯМР нелегированного соединения зависит от временно́го интервала между возбуждающими импульсами: в спектре можно выделить основную часть и дополнительную линию на частоте 33 MHz, которая регистрируется лишь при малых (порядка $10-30 \,\mu s$) задержках между возбуждающими импульсами. В легированных соединениях (рис. 1) эта линия исчезает, в то время как в высокочастотной части спектра появляется другая дополнительная



Рис. 1. Спектры ЯМР ядер 53 Сг в СuCr_{2-x}Sb_xS₄ при T = 77 К. Сплошные линии — эксперимент, штриховые — расчетные спектры.



Рис. 2. Спектр ЯМР ядер ⁵³Сг до (1) и после (2) отжига образца.

быстрорелаксирующая линия, максимум которой лежит примерно на частоте 41.5 MHz.

Нами было сделано предположение, что низкочастотная линия в нелегированном соединении обусловлена ионами хрома, расположенными вблизи анионных вакансий. Для проверки этого предположения был произведен отжиг образца в парах халькогена (серы). Отжиг проводился в течение 9 h при температуре 600°C в вакуумированной кварцевой ампуле. Масса образца 585 mg, масса добавленной серы 50 mg. На рис. 2 представлены спектры ЯМР ядер ⁵³Cr для образца до (линия 1) и после отжига (линия 2). Как следует из рис. 2 отжиг в парах серы действительно приводит к исчезновению дополнительной спектральной линии.

3. Обсуждение экспериментальных результатов

3.1. Основная часть спектра. При анализе основной части спектра будем исходить из одноосной локальной симметрии *B*-позиций. Ядро ⁵³Сг является квадрупольным ядром со спином I = 3/2. Спектр такого ядра представляет собой триплет, состоящий из центральной линии на частоте магнитного спектроскопического перехода $\pm 1/2 \leftrightarrow \pm 1/2$ и двух квадрупольных сателлитов. Резонансная частота ν зависит от угла θ — угла между вектором электронной намагниченности и кристаллографическим направлением $\langle 111 \rangle$. Частота ЯМР описывается выражением

$$\nu = \nu_0 + (\nu_A \pm \nu_q)(3\cos^2\theta - 1 + \eta\sin^2\theta\cos 2\varphi).$$
(1)

Здесь v_0 — изотропная постоянная, v_A — анизотропная постоянная, v_q — квадрупольная постоянная, η — параметр асимметрии. Эта формула определяет резонансные частоты квадрупольных сателлитов. Для центальной линии $v_q = 0$.

В работе [9] полагалось, что угол θ принимает два фиксированных значения (0 и $\pi/2$), а численные значения констант выбирались следующими: $v_0 = 38.47$ MHz, $v_A \approx 0.34$ MHz и $v_q \approx 0.6$ MHz. Основное расхождение между теорией и экспериментом в этом случае наблюдается в низкочастотной части спектра, которая в работе [9] зарегистрирована не была.

При анализе неоднородно уширенной спектральной линии будем исходить из того, что угол θ может равновероятно принимать любые значения. В этом случае реализуется спектр порошка [10] и для квадрупольного ядра со спином I = 3/2 спектральная линия может быть представлена модельным спектром, состоящим из трех пиков,

$$g_{1}(\nu) = \frac{1}{8\pi\Delta\nu}$$

$$\times \int_{0}^{2\pi} \frac{d\varphi}{\sqrt{(3-\eta\cos 2\varphi)(1-\eta\cos 2\varphi + (\nu_{0}-\nu)/\Delta\nu)}} \quad (2)$$

при $\nu_0 - 2\Delta\nu < \nu < \nu_0 + \Delta\nu(1 - \eta \cos 2\varphi)$ и $g_1(\nu) = 0$ при остальных значениях частоты ν . Для центральной

x	ν_0, MHz	ν_A, MHz	ν_q, MHz	η	σ
0 0.02	37.95 ± 0.01 37.80 ± 0.01 $40.32 \pm 0.01^*$	$\begin{array}{c} 1.54 \pm 0.01 \\ 1.52 \pm 0.01 \end{array}$	$\begin{array}{c} 0.45 \pm 0.01 \\ 0.45 \pm 0.01 \end{array}$	$\begin{matrix}0\\0.095\pm0.005\end{matrix}$	$\begin{array}{c} 0.04 \pm 0.01 \\ 0.06 \pm 0.01 \\ 0.30 \pm 0.05^{*} \end{array}$
0.07	$\begin{array}{c} 38.10 \pm 0.01 \\ 40.64 \pm 0.01^* \end{array}$	1.30 ± 0.01	0.46 ± 0.01	0.200 ± 0.005	$0.46 \pm 0.01 \\ 0.46 \pm 0.05^*$

Таблица 1. Значения констант, полученные при аппроксимации спектров эха ядер ⁵³Сг

* Значения относятся к высокочастотной линии 41.5 MHz.

линии Δv принимает значение v_A , а для квадрупольных сателлитов — $v_A \pm v_q$. Будем полагать также, что при фиксированном значении угла θ неоднородное уширение спектральной линии описывается функцией Гаусса с дисперсией σ

$$g_2(\nu - \nu') = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(\nu - \nu')^2}{2\sigma^2}\right).$$
(3)

Тогда наблюдаемая форма линии g(v) может быть представлена в виде [11]

$$g(\nu) = \int_{-\infty}^{\infty} g_1(\nu') g_2(\nu - \nu') d\nu'.$$
 (4)

Выражение (4) использовалось для численной аппроксимации основной части экспериментальных спектров. Константы v_0 , v_A , v_q и η варьировались так, чтобы обеспечить минимальное среднеквадратичное отклонение расчета от эксперимента. Высокочастотные линии в легированных образцах также аппроксимировались выражением (4). Результаты аппроксимации показаны штриховыми линиями на рис. 1, а соответствующие значения параметров представлены в табл. 1.

Как следует из данных табл. 1, легирование сурьмой приводит к увеличению неоднородного уширения σ , что в целом характерно для ЯМР в магнитоупорядоченных веществах. Кроме того, получено увеличение параметра асимметрии η . Это обусловлено тем, что как анизотропная, так и квадрупольная постоянные чувствительных к зарядам и магнитным моментам, локализованным на узлах кристаллической решетки. Увеличение параметра асимметрии отражает факт понижения симметрии локального окружения при замещении ионов хрома ионами сурьмы.

3.2. А низотропная постоянная. Анизотропная постоянная содержит два вклада: собственный и решеточный. Для оценки величины решеточного вклада будем использовать модель точечных магнитных диполей, в рамках которой рассчитываются поля на ядрах, созданные магнитными моментами ионов решетки.

В случае халькогенидных шпинелей хрома достаточно учесть лишь магнитные моменты ионов хрома. Предполагается, что в силу обменной связи магнитные моменты всех ионов ориентированы вдоль одного и того же кристаллографического направления. Ввиду достаточно медленного убывания дипольного поля с расстоянием при расчетах нельзя ограничиться только первой координационной сферой, а следует учесть вклады и более удаленных ионов. Увеличение радиуса сферы суммирования приводит к повышению точности рассчитанной величины поля. В результате проведенных расчетов найдено, что при учете ионов, удаленных от данного не более чем на шесть параметров ячейки (14 460 ионов), дипольное поле вычисляется с точностью не хуже 0.5%.

Сплошными линиями на рис. 3 показаны расчетные значения решеточного вклада в анизотропную константу как функция параметра ячейки при различных величинах магнитного момента ионов, занимающих в структуре шпинели *B*-позиции.

Представляется интересным сравнить результаты расчетов с экспериментальными данными для ряда халькогенидных шпинелей. Светлыми кружками на рис. 3 представлены экспериментальные значения анизотропной постоянной при T = 4.2 К из работы [12]. Численные значения параметра ячейки взяты из работы [1]. В этих соединениях хром находится в трехвалентном состоянии, и с хорошей точностью можно полагать, что на один ион приходится три магнетона Бора. Как следует из рис. 3, для описания экспериментально наблюдаемых значений только решеточного вклада недостаточно. Наряду с решеточным вкладом имеет место вклад собственной электронной оболочки иона в анизотропию локального магнитного поля на ядре. По всей видимости, этот вклад обусловлен ковалентными эффектами,



Рис. 3. Расчет решеточного вклада в анизотропную константу.

 v_q , MHz Параметр Анионный Расчет Соединение ячейки, Å параметр и Эксперимент Модель точечных Модель точечных зарядов и диполей зарядов CdCr₂S₄ 10.240 0.3901 0.047 0.594 0.95 CdCr₂Se₄ 10.755 0.3894 0.027 0.568 0.98 CuCr₂S₄ 0.3841 -0.099.814 0.740 0.45 CuCr₂Se₄ -0.1490.097 10.334 0.38 0.589 HgCr₂S₄ 0.391 0.067 0.649 0.95 10.237 0.019 0.99 HgCr₂Se₄ 10.753 0.389 0.568

Таблица 2. Градиент электрического поля на ядрах хрома

приводящими к переносу электронной плотности на e_g -орбиталь иона хрома.

Темный кружок на рис. 3 соответствует экспериментальному значению анизотропной постоянной в $CuCr_2S_4$, рассчитанному по формуле (1). Параметр ячейки $CuCr_2S_4$ также взят из работы [1]. Как следует из данных рис. 3, для медной шпинели отклонение экспериментального значения от значения, рассчитанного в рамках модели точечных диполей, существенно выше, чем для кадмиевой и ртутной шпинелей. Такое различие объясняется валентным состоянием хрома в $CuCr_2S_4$.

Действительно, при T = 77 K хром может быть равновероятно обнаружен в состояниях Cr^{3+} и Cr^{4+} . Состояние Cr^{4+} характеризуется наличием сильной спинорбитальной связи, что отражает существенное отклонение симметрии электронной оболочки от сферической. В случае сферически-несимметричной электронной оболочки е вклад в анизотропную постоянную существен.

Исходя из экспериментального значения анизотропной постоянной в $CuCr_2S_4$ можно получить оценку этой величины для состояния Cr^{4+} . Поскольку в анализируемом случае реализуется ситуация быстрого обмена, экспериментально наблюдаемое значение анизотропной постоянной в $CuCr_2S_4$ есть среднее этой постоянной в состояниях Cr^{3+} и Cr^{4+}

$$\nu_A(\mathrm{Cr}^{3.5+}) = [\nu_A(\mathrm{Cr}^{3+}) + \nu_A(\mathrm{Cr}^{4+})]/2. \tag{5}$$

Полагая, что анизотропная постоянная иона Cr^{3+} в $CuCr_2S_4$ того же порядка, что и в других халькогенидных шпинелях $\nu_A(Cr^{3+}) \approx 0.5 - 0.6$ MHz, для ионов Cr^{4+} получаем $\nu_A(Cr^{4+}) \approx 2.3 - 2.4$ MHz.

Замещение ионов хрома ионами Sb⁵⁺ в октаэдрических позициях шпинели должно приводить к уменьшениию доли четырехвалентных ионов хрома, что в свою очередь должно вызывать смещение анизотропной постоянной в сторону $v_A(Cr^{4+})$. Как следует из данных табл. 1 увеличение концентрации легирующей примеси действительно приводит к уменьшению v_A .

3.3. Квадрупольная постоянная. Квадрупольная постоянная v_q в одноосной кристаллографической позиции определяется квадрупольным моментом ядра Q и градиентом электрического поля (ГЭП) V_{zz} на ядре:

 $v_q = lQV_{zz}/4h$ (в случае спина I = 3/2). Компонента тензора ГЭП V_{zz} может быть представлена в виде суммы решеточного V_{zz}^l и собственного (или валентного) V_{zz}^c вкладов [13]

$$V_{zz} = (1 - \gamma_{\infty})V_{zz}^{l} + (1 - R)V_{zz}^{e},$$
(6)

где R и γ_{∞} — константы экранирования и антиэкранирования.

Решеточный вклад может быть оценен в рамках модели, согласно которой каждый ион является точечным зарядом соответствующей величины. Кроме того, в структуре шпинели локальная симметрия анионных позиций допускает наличие электрического дипольного момента, и дипольный вклад в квадрупольную постоянную может оказаться более существенным, чем вклад только точечных зарядов [14].

Необходимость учета электрических дипольных моментов анионов приводит к двухэтапному расчету квадрупольной постоянной. На первом этапе рассчитываются дипольные моменты, а затем собственно решеточный вклад. Для расчета дипольных моментов используется итерационная процедура. Сначала полагается, что электрическое поле на анионе создается только точечными электрическими зарядами (как катионов, так и анионов). На основании рассчитанного поля вычисляются электрические дипольные моменты анионов, и процедура расчета повторяется вновь уже с учетом дипольных полей анионов. Расчеты заключаются тогда, когда новое значение рассчитанного дипольного момента с заданной точностью совпадает с предыдущим значением.

Значения решеточного вклада v_q^l , рассчитанные с точностью не хуже 1% для ряда халькогенидных шпинелей хрома при радиусе сферы суммирования в шесть параметров ячейки, приведены в табл. 2. Для поляризуемости анионов α использовались численные значения из работы [15]. Структурные данные взяты из [1].

В отличие от анизотропной постоянной расчетные значения квадрупольной постоянной v_q^l не могут быть использованы для непосредственного сравнения с экспериментальными значениями. Это обусловлено тем, что экспериментально наблюдаемое значение v_q отличается

от расчетного ν_q^l в $1-\gamma_\infty$ раз, где γ_∞ — фактор антиэкранирования [13].

В табл. 2 приведены экспериментальные значения квадрупольной постоянной для кадмиевой и ртутной шпинелей из работы [12]. В данных соединениях при температуре 4.2 К ион хрома находится в состоянии Cr^{3+} . Полагая электронную оболочку иона Cr^{3+} в первом приближении сферически-симметричной, вкладом валентных электронов в градиент поля на ядре будем пренебрегать. Тогда при сравнении расчетных и экспериментальных значений квадрупольной константы для константы антиэкранирования получаем $1 - \gamma_{\infty} = 1.46 - 1.73$. Относительно небольшой диапазон численных значений фактора $1 - \gamma_{\infty}$ в первом приближении позволяет ограничиться в случае ионов Cr^{3+} учетом только решеточного вклада.

В сульфохромите меди частота обмена $Cr^{3+} \leftrightarrow Cr^{4+}$ выше, чем разность квадрупольных расщеплений спектров ЯМР в каждом из состояний. Это дает основания проводить расчет v_q^l для сульфохромита меди в предположении, что ион меди одновалентен, а валентность хрома Cr составляет +3.5 (табл. 2). При сравнении расчетных и экспериментальных результатов будем полагать, что экспериментально наблюдаемое значение квадрупольной постоянной равно среднему значению этой величины в состояниях Cr^{3+} и Cr^{4+}

$$v_q(\operatorname{Cr}^{3.5+}) = [v_q(\operatorname{Cr}^{3+}) + v_q(\operatorname{Cr}^{4+})]/2.$$

Кроме того, будем полагать, что "размораживание" орбитального момента для иона Cr^{4+} настолько мало, что вкладом валентных электронов в градиент поля на ядре в первом приближении можно пренебречь. Тогда для Cr^{4+} получаем $1 - \gamma_{\infty} = 2.87 - 3.14$. Это значение фактора антиэкранирования для четырехвалентного хрома больше, чем для трехвалентного, что хорошо согласуется с понижением симметрии электронной оболочки в состоянии Cr^{4+} и с результатами, полученными для анизотропной постоянной. Относительно близкие значения фактора антиэкранирования для ионов Cr^{3+} и Cr^{4+} приводят к тому, что легирование сурьмой не оказывает существенного влияния на квадрупольное расщепление спектра ЯМР (табл. 1).

3.4. Дополнительные спектральные линии. В низкочастотной области спектров ЯМР ⁵³Сг в нелегированной шпинели наблюдается дополнительная быстрорелаксирующая линия. Мы полагаем, что природа этой линии связана с анионными вакансиями в CuCr₂S₄. Известно, что появление анионных вакансий в халькогенидных шпинелях хрома приводит лишь к локальным искажениям кристаллической решетки, не изменяя общей симметрии и параметра ячейки CuCr₂S_{4-y} при $0 \le y \le 0.17$.

Ионы хрома занимают в структуре шпинели октаэдрические позиции. Ближайшее окружение хрома шесть анионов. Линии, соединяющие ионы хрома с ближайшими анионами, проходят вдоль направлений типа (100) кристаллической структуры шпинели. В случае



Рис. 4. Примесный центр на основе анионной вакансии.



Рис. 5. Расположение иона сурьмы в структуре шпинели.

образования анионной вакансии в ближайшем окружении одно из направлений типа $\langle 100 \rangle$ становится симметрийно выделенным, и угол θ в выражении (1) должен отсчитываться от этой оси (рис. 4).

Компенсация заряда анионной вакансии в примесном центре осуществляется за счет понижения валентности хрома (т.е. $2Cr^{4+} \rightarrow 2Cr^{3+}$). Анионная вакансия в ближайшем окружении хрома приводит к уменьшению переноса электронной плотности на ион хрома. По-видимому, результатом уменьшения переноса электронной плотности является фиксация локальной электронной намагниченности вдоль направления типа $\langle 111 \rangle$. При этом угол θ в выражении (1) принимает значение "магического" угла и спектр вырождается в одиночную линию. С другой стороны уменьшение переноса электронной плотности приводит к уменьшению сверхтонкого магнитного поля на ядре хрома, что и наблюдается экспериментально.

Более быстрая релаксация дополнительной линии в нелегированном CuCr₂S₄ также хорошо согласуется с предлагаемым механизмом, так как появление вакансии дает дополнительный канал связи ядерной спиновой системы с кристаллической решеткой, выступающей в релаксационных процессах в качестве термодинамического резервуара.

Легирование сурьмой (даже в небольших количествах) приводит к исчезновению низкочастотной дополнительной линии. По-видимому, появление ионов Sb⁵⁺, положительный заряд которых выше, чем положительный заряд основных ионов хрома, приводит к исчезновению анионных дефектов.

Влияние примесей сурьмы на спектры ЯМР хрома будем полагать подобным влиянию анионных вакансий, а именно: симметрийно выделенным становится направление типа $\langle 110 \rangle$ как направление от иона хрома к ближайшему иону сурьмы (рис. 5). Однако примесный дефект Sb⁵⁺ не приводит к фиксации электронной намагниченности, и при анализе спектров предполагается, что угол θ , так же как для основной части спектра, может равновероятно принимать любые значения (табл. 1).

При замещении ионов хрома ионами сурьмы компенсация валентности катионной подрешетки происходит за счет увеличения в примесном центре ионов Cr^{3+} (так, при x = 0.5 в соединении остается только Cr^{3+}). Поэтому частота примесной линии в этом случае наблюдается в высокочастотном диапазоне.

Наличие высокочастотной линии в легированных образцах свидетельствует о том, что появляются ионы (или ионные кластеры) хрома с большими спиновыми плотностями. Другими словами, при замещении ионов Cr^{4+} ионами большей валентности (Sb^{5+}) появляются комплексы, состоящие из двух ионов Cr^{3+} и одного Cr^{4+} , между которыми происходит быстрый электронный обмен. Поскольку величина магнитного момента ионов хрома определяется числом неспаренных 3d-электронов, для комплекса из трех кристаллографических эквивалентных ионов ($Cr^{3+} \leftrightarrow Cr^{4+} \leftrightarrow Cr^{3+}$), обменивающихся одним 3d-электроном, величина магнитного момента будет составлять $2\frac{2}{3}\mu_{\rm B}$. Частотное положение высокочастотной линии (табл. 1) как раз соответствует ионам этих комплексов.

4. Заключение

Анализ спектров ЯМР ядер ⁵³Cr в CuCr_{2-x}Sb_xS₄ при T = 77 K показывает, что для квадрупольных ядер в локально анизотропных позициях эффекты переменной валентности приводят к усреднению не только резонансной частоты, но и квадрупольной и магнитной анизотропной постоянных.

Наличие равновесной концентрации анионных вакансий приводит к появлению дополнительной низкочастотной линии в спектре ЯМР ⁵³Сг. Это свидетельствует об ослаблении обменных связей ионов Сг в дефектных центрах на основе анионных вакансий.

Примесные центры на основе Sb⁵⁺ дают дополнительный сигнал в высокочастотной части спектра. Появление этой линии связано с изменением соотношения концентрации ионов Cr^{3+} и Cr^{4+} в результате компенсации валентности.

Решеточная модель расчета дипольных магнитных и электрических полей не в состоянии объяснить экспериментальные значения их анизотропии. Это приводит к необходимости учета собственного вклада электронной оболочки ионов. Найденные значения анизотропной и квадрупольной постоянных иона Cr^{4+} существенно выше аналогичных величин для ионов Cr^{3+} , что обусловлено электронной конфигурацией ионов Cr^{4+} . Асимметрия электронного облака ионов Cr^{4+} связана со спин-орбитальным взаимодействием, которое для Cr^{4+} значительно больше, чем для ионов Cr^{3+} в $CdCr_2S_4$.

Авторы выражают благодарность Т.Г. Аминову и Г.Г. Шабуниной за изготовление образцов, а также С.В. Ягупову, Н.С. Непевной и Н.Е. Полехину за помощь в проведении отжига.

Список литературы

- К.П. Белов, Ю.Д. Третьяков, И.В. Гордеев, Л.И. Королева, Я.А. Кеслер. Магнитные полупроводники — халькогенидные шпинели. Изд-во МГУ, М. (1981). 279 с.
- [2] М.И. Куркин, Е.А. Туров. ЯМР в магнитоупорядоченных веществах и его применения. Наука, М. (1990). 248 с.
- [3] К.М. Салихов, А.Г. Семенов, Ю.Д. Цветков. Электронное спиновое эхо и его применения. Наука, Новосибирск (1976).
- [4] Н.М. Бажин, К.М. Салихов. ЭПР релаксация свободных радикалов в жидкостях. Наука, Новосибириск (1973).
- [5] N.M. Kovtun, V.K. Prokopenko, A.A. Shemyakov. Solid State Commun. 26, 877 (1978).
- [6] Н.М. Ковтун, В.К. Прокопенко, А.А. Шемяков, Т.Г. Аминов, Г.Г. Шабунина. ФТТ 24, 9, 2814 (1982).
- [7] В.Н. Бержанский, А.И. Горбованов, С.Н. Полулях. ЖЭТФ 115, 6, 2106 (1999).
- [8] Т.Г. Аминов, Т.И. Арбузова, Г.Г. Шабунина, В.М. Новотворцев. НМММ-2000, Изд-во МГУ, М. (2000). С. 188.
- [9] H. Figel, J. Kukucz, A. Bombik. J. Magn. Magn. Mater. 15–18, 701 (1980).
- [10] У. Хеберлен, М. Меринг. ЯМР высокого разрешения в твердых телах. Мир, М. (1980). 504 с.
- [11] И.В. Александров. Теория магнитной релаксации. Релаксация в жидкостях и твердых неметаллических парамагнетиках. Наука, М. (1975). 400 с.
- [12] G.H. Stauss. Phys. Rev. 181, 636 (1969).
- [13] R.E. Watson, A.J. Freeman. Hyperfine Interactions / Ed. A.J. Freeman, R.B. Frankel. Academic Press, N.Y. (1967).
- [14] R. Kirsch, A. Gerard, M. Wautelet. J. Phys. C. 7, 3633 (1974).
- [15] Ч. Китель. Введение в физику твердого тела. Наука, М. (1978). 791 с.